

# TRI

*TR-5000 Series 手冊*

## C.測試原理

## C-1 類比元件測試原理

### **C-1-1 OPEN / SHORT 測試原理**

C-1-1-1 為什麼使用短路群(SHORT GROUP)

C-1-1-2 如何形成短路群

C-1-1-3 如何決定 RAW THD 之值

C-1-1-4 短路測試原理

C-1-1-5 OPI 與 SPI 測試

### **C-1-2 JUMPER 測試原理**

C-1-2-1 MODE 0 (使用開路/短路程 OPS 量測)

C-1-2-2 MODE 1 (使用電阻量測)

C-1-2-3 MODE 2 (使用電阻量測)

### **C-1-3 電阻量測**

C-1-3-1 電阻測試原理

C-1-3-2 定電流源量測 MODE 0

C-1-3-3 低電流之定電流源量測 MODE1

C-1-3-4 快速電阻測試 MODE2

### **C-1-4 電容量測**

C-1-4-1 電容測試原理

C-1-4-2 AC MEASURE (MODE 0,1,2,3)

C-1-4-3 CX // RX (MODE 5,6,7)

C-1-4-4 DC CONSTANT CURRENT TEST MODE4, MODE8

### **C-1-5 電感量測**

C-1-5-1 電感量測原理

C-1-5-2 AC MEASURE (MODE 0,1,2,3)

C-1-5-3 Lx // Rx (MODE 5,6,7)

### **C-1-6 電晶體量測 MEASUREMENT OF TRANSISTOR**

C-1-6-1 VCE 量測 (MODE3, 4)

C-1-6-2 HFE 量測 (MODE12, 13)

### **C-1-7 FET 量測 (MODE14, 15)**

### **C-1-8 IC CLAMPING DIODE 量測**

### **C-1-9 AGILENT 測試技術**

C-1-9-1 AGILENT TESTJET 測試原理

### **C-1-10 三端電容極性測試技術**

C-1-10-2 三端電容極性測試原理

C-1-10-3 三端電容極性測試程式說明

### **C-1-11 隔離效果原理的探討**

## C-2 數位元件測試原理

### **C-2-1 TTL 邏輯閘測試原理(TTL LOGIC TEST THEOREM)**

C-2-1-1 輸入及輸出順序(INPUT AND OUTPUT SEQUENCE)

C-2-1-2 GROUP 設定技巧

### **C-2-2 TREE-CHAIN 測試原理**

C-2-2-1 測試命令執行動作

C-2-2-2 TREE CHAIN 測試演算法(TREE CHAIN TEST ALGORITHM)

### **C-2-3 MEMORY 測試原理**

C-2-3-1 WALKING ONE FOR ADDRESS BUS

C-2-3-2 WALKING ZERO FOR ADDRESS BUS

C-2-3-3 DATA BUS

### **C-2-4 I2C 基本概念**

### **C-2-5 P2C 基本概念**

### **C-2-6 BOUNDARY-SCAN 測試原理**

C-2-6-1 BOUNDARY-SCAN 基本概念

C-2-6-2 BOUNDARY-SCAN 測試原理

### **C-2-7 快閃記憶體(FLASH MEMORY)測試原理**

### **C-2-8 MWIRE SERIAL EEPROM 基本概念**

### **C-2-9 ISP 測試原理**

## C-2-10 SPI SERIAL MEMORY 基本概念